

ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВІВ Tl-Se В ШИРОКОМУ КОНЦЕНТРАЦІЙНОМУ Й ТЕМПЕРАТУРНОМУ ДІЯПАЗОНАХ

В. М. Склярчук, Ю. О. Плевачук, В. П. Дідух

Львівський національний університет

імені Івана Франка, фізичний факультет

бул. Генерала Чупринки, 49, Львів, 79044, Україна

(Отримано 17 грудня 2001 р.; в остаточному вигляді — 29 квітня 2002 р.)

В умовах високого тиску аргону (до 25 МПа) при температурах до 1600 К вимірюють електропровідність та термо-е.р.с. розплавів системи $Tl_{1-x}Se_x$ в концентраційній ділянці ($0 < x < 0.4$). Показано, що немає единого підходу до аналізу електронних властивостей розплавів Tl-Se з надлишком селену або талію щодо Tl_2Se . Для концентрацій з надлишком селену результати інтерпретують у припущені, що вихідна матриця може бути легованою Se, який створює акцепторні рівні. Концентрації з надлишком Tl попадають у ділянку обмеженої розчинності компонентів, для яких відзначено суттєву зміну в значеннях електропровідності співіснуючих рідин при розшаруванні. За результатами $\sigma(T)$ уточнено криву співіснування рідина–рідина та параметри критичної точки: $x_C = 19.7 \pm 0.1$ ат.% Se і $T_C = 1036 \pm 2.1$ К. Критичні індекси β та $(1 - \alpha)$ оцінено відповідно як 0.35 ± 0.02 і 0.87 ± 0.02 . Асиметрію кривої розшарування та нелінійність її діаметра проаналізовано в порівнянні з відомими даними для рідких металів у ділянці критичної точки рідина–пара.

Ключові слова: Йонний транспорт, халькогеніди, перехід напівпровідник–метал, термо-е.р.с., електропровідність, рівновага рідина–рідина, енергетичний спектр.

PACS number(s): 64.70.-p, 71.22.+i

I. ВСТУП

Система Tl–Se зазнає суттєвих змін електронних властивостей в колі стехіометричного складу Tl_2Se . Розплави в концентраційному діапазоні, починаючи від сполуки Tl_2Se , з подальшим збільшенням умісту селену є термодинамічно однорідними. Поведінка властивостей таких розплавів добре описується моделями, які запропонував Мотт [1], що передбачає наявність різких крайів за рухливістю у хвостах зон провідності й валентності. Ріст температури приводить до зменшення енергетичної щіlinи, яка стає співісною з kT . Цей факт трактуємо як перехід напівпровідник–метал. Ця концепція в загальніх рисах була підтверджена експериментально. Проте одночасний вплив двох механізмів переносу заряду на структуру енергетичного спектра і відповідно на закономірності металізації напівпровідникового розплаву є маловивченим. Подібні дослідження нечисленні [2], а безпосередньо в ділянці металізації не проводились узагалі.

Розплави з надлишком талію щодо Tl_2Se характеризуються ділянкою обмеженої розчинності компонентів [3]. Частина із цих сумішей у концентраційному діапазоні розділення фаз рідина–рідина зазнає також переходу метал–неметал. Це явище наявне, зокрема, в метал–аміачних розчинах, розчинах лужних металів, у розплавах відповідних галогенідів, а також у рідких сплавах метал–халькоген [2]. Щодо рідких металів, то в колі критичної точки рідина–газ у них спостерігаємо кореляцію фазового переходу з переходом метал–діелектрик. Однак на відміну від металів в колі критичної точки рідина–пара [4], природа фазорозділення в подвійних системах із розши-

руванням і поведінка їхніх властивостей у критичній ділянці рідина–рідина залишається слабо вивченою. Теоретичні спроби зmodелювати кореляцію між переходами метал–неметал і рідина–пара або рідина–рідина поки що недостатні для відповіді на поставлене питання [5,6].

II. ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Система Tl–Se належить до складних об'єктів експериментального дослідження у зв'язку з наявністю дуже агресивного леткого компонента — селену. Тому для проведення вимірювань необхідно розв'язати низку технічних питань. Зокрема: 1) забезпечити стабільний хемічний склад досліджуваного розплаву протягом усього експерименту; 2) запобігти хемічній взаємодії компонентів розплаву з конструкційними матеріалами; 3) підібрати матеріали для виготовлення експериментальних контейнерів.

Щоб розв'язати вказані проблеми, при вимірюванні електропровідності й термо-е.р.с. ми використали методику подавлення процесів кипіння й випаровування зовнішнім тиском нейтрального газу. Вимірювання проводили у спеціальній камері високого тиску (до 25 МПа) при температурі до 1600 К. Було використано спеціально розроблений контейнер з нітриду бору, особливість конструкції якого полягає в тому, що він виготовлений у вигляді двох співвісних циліндрів з різними, але співірічними радіусами. Глибина проникнення агресивного розплаву в кераміку вважається величиною постійною. Таким чином, ми отримали змогу аналітичним шляхом усу-

нуті похибки, які виникають при утворенні шунтувального шару. Безпосередній контакт “вимірювальна лінія–розплав” забезпечували через графітові електроди, у які запресовували термопарні електроди, що, в свою чергу, використовувалися як потенціальні і струмові контакти. Використовували термопари BP5/BP20. Геометричні розміри контейнера розраховували на базі загального гідродинамічного рівняння Нав'є–Стокса. Наважені з точністю до 10^{-4} г, компоненти Tl (99.998% чистоти) і Se (99.999%) змішували у відкачаних до 10 Па і запаяних кварцевих ампулах. Потім зразок заплавляли під тиском у вимірювальну комірку. При цьому втрати не перевищували 0.02 ат.%. Електропровідність вимірювали традиційним чотиризондовим методом на змінному струмі, а термо-е.р.с. — за відомою методикою з контролюванням градієнтом температури в 10–15 К. Похибка вимірювання електропровідності складає 2%, а термо-е.р.с. — 5%. Вимірювальну установку і процедуру вимірювань описано в [7].

ІІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Електропровідність $\sigma(T)$ та термо-е.р.с. $S(T)$ розплавів системи Tl–Se визначали з концентраційним кроком 5 ат. % зі зменшенням до 2 ат. % при наближенні до стехіометричного складу Tl_2Se .

Результати досліджень температурних залежностей $\sigma(T)$ та $S(T)$ у діапазоні обмеженої розчинності компонентів для деяких концентрацій, а також для Tl_2Se , $Tl_{68}Se_{32}$ подано на рис. 1–3 відповідно.

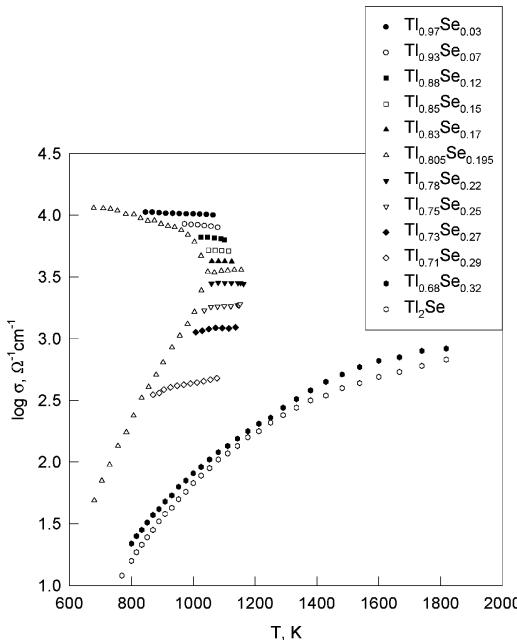


Рис. 1. Електропровідність розплавів системи $Tl_{1-x}Se_x$ з надлишком селену щодо Tl_2Se .

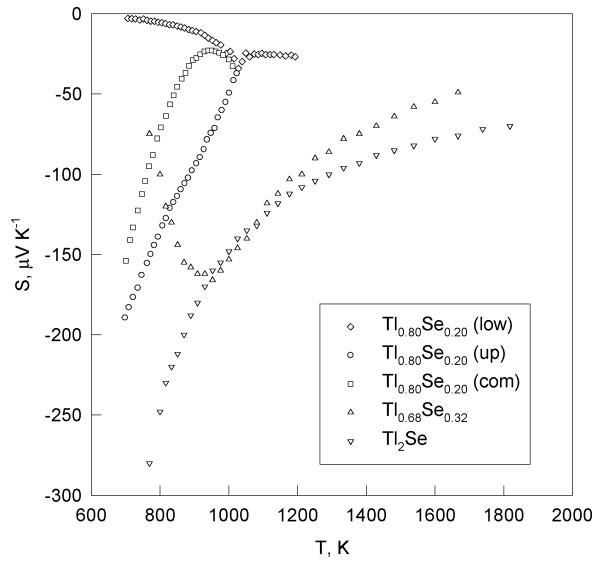


Рис. 2. Термо-е.р.с. розплавів системи $Tl_{1-x}Se_x$ з надлишком талію щодо Tl_2Se .

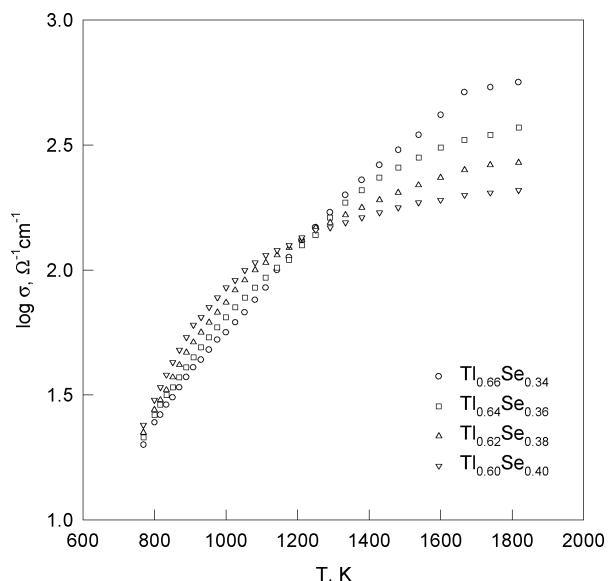


Рис. 3. Електропровідність розплавів системи $Tl_{1-x}Se_x$ з надлишком селену щодо Tl_2Se .

Як видно з рис. 1, електропровідність повністю гомогенізованих розплавів у ділянці розшарування проявляє лінійну залежність від температури, причому абсолютне значення σ у високотемпературній ділянці визначаємо, в основному, концентрацією компонентів. Для розплавів Tl_2Se , $Tl_{68}Se_{32}$ зберігається напівпровідникова залежність як $\sigma(T)$, так і $S(T)$. У ділянці розшарування лінійна залежність $\sigma(T)$ зберігається аж до температури розділу фаз $T_s(x)$, при якій розплав розшаровується на дві фази з появою межі розділу (меніска). Подальше охолодження су-

проводжується неперервним перерозподілом компонентів: фаза з більшою густиной, розміщена під меніском, збагачується Tl за рахунок легшої верхньої фази, що при цьому збагачується Se. Концентрації компонентів співіснуючих рідин x_1 і x_2 однозначно визначаються іхньою температурою відповідно до кривої розшарування, що є геометричним місцем точок $T_s(x)$ на фазовій діаграмі Tl-Se.

При однаковій зміні температури принципово відмінні концентрації рідин формують різні температурні залежності електронних властивостей кожної фази. В експерименті це проявляється як початок розгалуження в точці $T_s(x)$ температурної залежності $\sigma(T)$ на дві гілки [8].

Як випливає з рис. 2, де показано усереднену за всією висотою зразка температурну залежність термо-е.р.с. розплаву $Tl_{0.80}Se_{0.20}$, при охолодженні гомогенного розплаву у високотемпературній ділянці поведінка $S(T)$ якісно подібна до поведінки $\sigma(T)$, а саме — спостерігається її незначне зростання. При цьому значення $S(T)$ є однаковим за висотою зразка. При температурі близько 1040 К спостерігаємо розгалуження кривої $S(T)$, що свідчить про початок розшарування. Обидві криві $S_1(T)$ і $S_2(T)$ спадають з охолодженням, досягаючи, відповідно, значень -130 і $-180 \mu V/K$. Таким чином, наявна кореляція залежностей $S(T)$ і $\sigma(T)$, з тією різницею, що температурний інтервал з T_C , у якому зазнає різких змін $S(20\text{ K})$, є ширшим від аналогічного інтервалу різкої зміни σ . Щодо абсолютних значень термо-е.р.с., то отримані результати добре узгоджуються з даними [8]. Дещо вищі температури початку розгалуження кривих $S_i(T)$ стосовно відповідних точок на кривих $\sigma_i(T)$ ми пояснюємо зміщенням по зонах початком процесу розшарування, що зумовлений температурним градієнтом [7].

Щодо розплавів $Tl_{68}Se_{32}$ і Tl_2Se (рис. 1–2), то дані є неочікуваними з точки зору класичної концепції металізації [1,2]. У всьому дослідженному інтервалі температур електропровідність зберігає властиву для напівпровідників експоненціальну залежність з енергією активації $2E(0) = 0.98\text{ eV}$. Термо-е.р.с. при цьому монотонно зменшується і майже досягає металевих значень. Її від'ємний знак говорить про домінуючий електронний внесок у механізм переносу заряду. На користь металізації свідчить абсолютна величина термо-е.р.с. в діапазоні температур вище від 1000 К. Поряд із цим виявлена 'U'-подібна залежність термо-е.р.с. не інтерпретується відомими концепціями металізації. При експоненціальному рості електропровідності термо-е.р.с., зберігаючи від'ємний знак, спочатку зростає, а потім плавно зменшується до металевих значень. Порівняння поведінки кінетичних коефіцієнтів для цих об'єктів дозволяє стверджувати, що механізм переносу заряду не є однотипним.

На рис. 3–4 зображені залежності електропровідності й термо-е.р.с. розплавів з надлишком селену щодо стехіометричного складу.

Розглянемо, для прикладу, розплав $Tl_{0.66}Se_{0.34}$. Як

бачимо, електропровідність повністю відповідає концепції металізації: експоненційний ріст електропровідності виходить на насичення. Збільшення вмісту селену приводить до зниження температури насичення електропровідності й до зменшення рівня насичення. Неочікуваним, на перший погляд, є збільшення електропровідності у високотемпературній ділянці. Це може відбуватись у двох випадках: зростання концентрації носіїв або появі додаткового внеску в провідність за рахунок інших носіїв. Термо-е.р.с. у всіх випадках різко зменшується з інверсією знака на від'ємний.

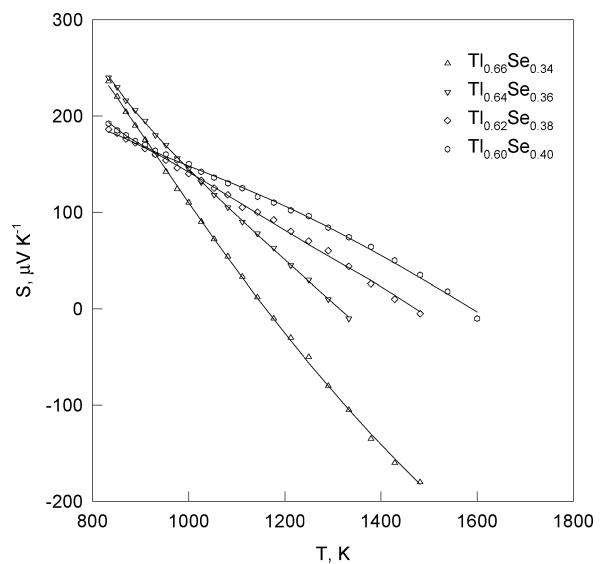
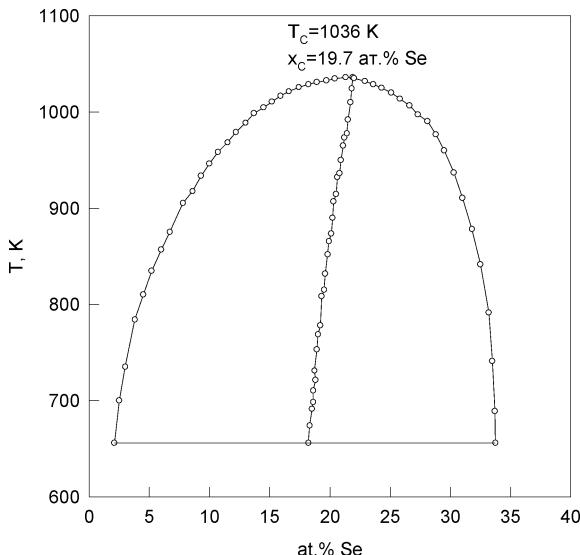


Рис. 4. Термо-е.р.с. розплавів системи $Tl_{1-x}Se_x$ з надлишком селену щодо Tl_2Se .

Сукупність наведених фактів свідчить про те, що єдиного підходу до аналізу результатів електронних властивостей у розплавах Tl-Se, які мають надлишковий щодо Tl_2Se Tl і надлишковий Se, немає. На відміну від класичного випадку легування, ми тут маємо не одну матрицю вихідної речовини, у якій можна за допомогою домішок створювати акцепторні або донорні рівні, а, по суті, різні за структурою розплави, причому в одному типі розплавів домінуючими носіями є дірки, а в іншому — електрони. Поступова трансформація енергетичного спектра електронів з ростом умісту Se іде, очевидно, шляхом зміни акцепторної зони поблизу краю зони провідності. Внаслідок того електрони, які збуджуються з валентної зони через псевдошіліну, потрапляють у ділянку локалізованих станів, де рухаються за рахунок термічної активації. На іхньому місці дірки, що утворилися у валентній зоні, мають значно вищу рухливість. Це й визначає поведінку електропровідності й термо-е.р.с. Особливості поведінки розплаву Tl_2Se з надлишком Tl пов'язані з близькістю межі розділу фаз, що може привести до утворення переколяційних каналів, які шунтують матрицю вихідного роз-

плаву. Однак строгі докази домішкової провідності в рідкому напівпровіднику тепер викликають певні труднощі, тому що відсутня достатня інформація про енергетичну структуру розплавів поблизу межі розділу фаз.

На рис. 5 зображено криву розшарування системи Tl–Se, визначену за результатами вимірювань електропровідності.



обох механізмів переносу заряду. Рівняння (3) включає йонну S_i та електронну S_e складові термо-е.р.с., тому кінцевий результат може бути записаний як:

$$S = t_e S_e + t_i S_i. \quad (4)$$

Таким чином, поведінку термо-е.р.с. можна пояснити тим, що при зміні температури змінюється t_i . Якщо допустити, що йонний і електронний внески в транспорт заряду незалежні, то їх електропровідність σ є сумою σ_i і σ_e .

- [1] N. Mott, E. Davis, *Electron processes in non-crystalline materials* (Clarendon Press, Oxford, 1979).
- [2] M. Cutler, *Liquid Semiconductors* (Academic Press, New York, 1977).
- [3] *Binary Alloy Phase Diagrams*, edited by T. B. Massalski (ASM International, US, 1990).
- [4] F. Hensel, J. Phys.: Cond. Matt. **2**, 33 (1990).
- [5] F. Yonezawa, T. Ogawa, Suppl. Prog. Theor. Phys. **72**, 1 (1982).
- [6] F. Hensel, H. Uchtmann, Ann. Rev. Phys. Chem. **40**, 61 (1989).
- [7] Yu. Plevachuk, V. Sklyarchuk, Measurement Science and Technology **12**, 23 (2001).
- [8] B. Sokolovskii, V. Didoukh, M. Wobst, W. Hoyer, Phys. Status Solidi A **139**, 153 (1993).
- [9] M. Ley-Koo, M. Green, Phys. Rev. A **16**, 2483 (1977).
- [10] S. Jungst, B. Knuth, F. Hensel, Phys. Rev. Lett. **55**, 2160 (1985).
- [11] H. K. Schurmann, R. D. Parks, Phys. Rev. Lett. **26**, 367 (1971).
- [12] R. V. Pettit, W. J. Camp, Phys. Rev. Lett. **32**, 369 (1974).
- [13] Л. А. Булавин, Ю. И. Шиманский, Письма журн. эксп. теор. физ. **29**, 8, 482 (1979).
- [14] Л. А. Булавин, *Критические характеристики бинарных растворов* (В кн. В. Я. Антонченко, А. С. Давыдов, В. В. Ильин. *Основы физики воды*) (Наукова думка, Київ, 1991). 70 ст.
- [15] C. Holzhey, W. Schirmacher, Z. Phys. Chem. **156**, 163, (1988).
- [16] Д. К. Белащенко, *Исследование расплавов методом электропереноса* (Атомиздат, Москва, 1974).
- [17] T. Usuki, J. Phys. Soc. Jpn **62**, 2, 634 (1993).
- [18] H. Rosolondramanitra, M. Cutler, Phys. Rev. B **29**, 5694 (1984).
- [19] K. Itoh, T. Usuki, S. Tamaki, J. Non-Cryst. Solids **250–252**, 336 (1999).
- [20] S. B. Lague, A. C. Barnes, A. D. Archer, W. S. Howells, J. Non-Cryst. Solids **205–207**, 89 (1996).
- [21] H. Matsuda, O. Uemura, T. Satow, Phys. Status Solidi A **90**, 77 (1985).
- [22] М. М. Клым, С. И. Мудрый, В. П. Гальчак, Изв. Акад. Нauk CCCP, сер. неорг. мат. **19**, 3, 356 (1983).
- [23] Ю. Г. Полтавцев, *Структура полупроводниковых расплавов* (Металлургия, Москва, 1984).

ELEKTROPHYSICAL PROPERTIES OF Tl-Se LIQUID ALLOYS IN THE WIDE CONCENTRATION AND TEMPERATURE RANGES

V. Sklyarchuk, Yu. Plevachuk, V. Didoukh
*Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of Physics,
 49 General Chuprynska Str., Lviv, UA-79044, Ukraine*
 plevachk@iap.franko.lviv.ua

Electrical conductivity and thermo-e.m.f. measurements were performed for binary $Tl_{1-x}Se_x$ liquid alloys in a wide temperature range (up to 1600 K) under ambient pressures of argon gas (up to 25 MPa). It was shown that no clear-cut approach to an explanation of electron properties of liquid Tl-Se alloys with a higher thallium or selenium content than in the stoichiometric compound Tl_2Se exists. The results for alloys with an excess of Se are construed on the assumption that the initial matrix can be doped by Se, which forms acceptor levels. Concentrations with an access of Tl fall within the miscibility gap region showing the different temperature dependencies of electrical conductivity of the coexisting liquids upon a stratification process. The liquid-liquid coexistence curve and parameters of the critical point were specified as $x_C = 19.7 \pm 0.1$ at.% Se and $T_C = 1036 \pm 2.1$ K on the basis of the electrical conductivity measurements. The critical indices β and $(1 - \alpha)$ were estimated as 0.35 ± 0.02 and 0.87 ± 0.02 , respectively. An asymmetry of the coexistence curve and the non-linearity of its diameter are analyzed in comparison with the available data for fluid metals in the vicinity of liquid-vapor critical point.